Резонансная брэгговская структура (AlGaAs/GaAs/AlGaAs)₆₀ на основе второго уровня размерного квантования экситонов с тяжелыми дырками в квантовых ямах

© В.В. Чалдышев[¶], Д.Е. Шолохов, А.П. Васильев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 22 марта 2010 г. Принята к печати 30 марта 2010 г.)

Проведены исследования спектров фотолюминесценции и оптического отражения от периодической структуры, содержащей 60 квантовых ям GaAs, разделенных туннельно-непрозрачными барьерами AlGaAs. Особенность структуры состояла в том, что при определенном угле падения света (~ 23°) брэгтовское условие резонансного отражения света выполнялось для энергий фотонов, равных энергии экситонов, образованных электронами с тяжелыми дырками на втором уровне размерного квантования в квантовых ямах. Экспериментально установлено, что в условиях двойного экситон-поляритонного и брэгговского резонанса происходит формирование суперизлучательной оптической моды. Изучены зависимости брэгговского и экситон-поляритонного отражения от угла падения света, поляризации и температуры.

В соответствии с теоремой Блоха распространение электромагнитных волн в среде с периодической модуляцией диэлектрической проницаемости є приводит к формированию зонной структуры — разрешенных и запрещенных энергетических зон для движения фотонов в направлении модуляции є. Характеристические длины волн, соответствующие запрещенным зонам, определяются условием Брэгга:

$$\lambda_m = \frac{2d\sqrt{\varepsilon - \sin^2\theta}}{m},\tag{1}$$

где *d* — период структуры, *θ* — угол падения света из внешней среды (воздуха), *m* — целое число.

Брэгговские структуры — одномерные фотонные кристаллы, отражающие свет в определенном диапазоне частот, находят широкое применение в полупроводниковых приборах, например, в качестве зеркал в полупроводниковых лазерах [1]. Такие структуры представляют собой периодическую систему слоев с различными показателями преломления — например, (GaAs/AlGaAs)_k.

Периодическую модуляцию диэлектрической проницаемости можно осуществить за счет резонансного взаимодействия электромагнитных волн с собственными электронными возбуждениями в среде, такими как экситонные возбуждения в квантовых ямах. Такие структуры получили название резонансных брэгговских структур (РБС) [2]. В РБС квантовые ямы должны располагаться с периодом, определяемым брэгговским условием (1), где длина волны λ_m должна соответствовать состоянию экситон-поляритона в квантовой яме.

В теоретических работах [2–11] были рассмотрены различные аспекты формирования зонной структуры РБС, в том числе влияние периодической модуляции фонового показателя преломления, разного в ямах и барьерах. Теория предсказывает, что электромагнитное взаимодействие экситонов в квантовых ямах при выполнении брэгговского условия должно приводить к усилению экситон-поляритонного резонанса и формированию суперизлучательной оптической моды, сила осциллятора которой пропорциональна числу квантовых ям, k, при не слишком большом числе периодов (k < 200 для системы (AlGaAs/GaAs/AlGaAs)_k).

Теоретические предсказания нашли подтверждение в эксперименте на примере периодических систем квантовых ям CdTe/CdMgTe [12], GaAs/InGaAs [13–16] и GaAs/AlGaAs [17–19]. В частности, было обнаружено резонансное усиление амплитуды и уширение полосы экситон-поляритонного отражения [13,16]. Специфические линейные и нелинейные оптические свойства РБС являются привлекательными для различных приборных применений [20].

В данной работе впервые предложен, создан и исследован новый тип РБС. В наших структурах резонансное электромагнитное взаимодействие реализуется между экситонами в основном состоянии, образованными тяжелыми дырками и электронами на втором уровне размерного квантования в квантовых ямах.

Основой для исследованных структур были выбраны квантовые ямы GaAs шириной 13 нм и барьеры AlGaAs, обеспечивающие достаточно большую высоту как для электронов, так и для дырок при малом рассогласовании параметра решетки с ямами и подложкой GaAs. Предварительные квантово-механические расчеты показали, что в таких ямах должно быть 3 квантовых уровня для электронов и легких дырок и 7 квантовых уровней для тяжелых дырок. Для экспериментального определения энергий экситонных возбуждений были выращены структуры с одиночными квантовыми ямами. Выращивание проводилось методом молекулярно-лучевой эпитаксии (установка RIBER-32) на подложках полуизолирующего GaAs диаметром 50 мм с ориентацией (001).

Исследования спектров люминесценции и отражения полученных структур проводились при температу-

[¶] E-mail: Chald@gvg.ioffe.ru



Рис. 1. Спектры фотолюминесценции (PL) при 4 К образца 7-787 с одиночной квантовой ямой и образца 7-789, содержащего 60 квантовых ям. Возбуждение лазером с длиной волны 633 нм. Стрелками отмечены линии люминесценции из барьера AlGaAs, подложки GaAs и квантовой ямы x(e1-hh1) — рекомбинация основного состояния экситона, образованного тяжелыми дырками и электронами на первом уровне размерного квантования. Для наглядности интенсивность люминесценции образца 7-787 увеличена в 10 раз.

рах 4–300 К, при различных углах падения и различных поляризациях света в диапазоне длин волн 600–900 нм. Для возбуждения фотолюминесценции использовался He–Ne-лазер ЛГH-113 с длиной волны излучения 0.6328 мкм. Источником белого света служил LS-1 с вольфрамовой галогеновой лампой накаливания. Спектры регистрировались с помощью малогабаритного спектрометра HR 4000 CG с кремниевым многоэлементным фотоприемником.

Спектр фотолюминесценции при 4К для образца 7-787 с одиночной квантовой ямой представлен на рис. 1 штриховой линией. Видно, что при надбарьерном возбуждении светом с длиной волны 632.8 нм основное излучение происходит на длинах волн 804 и 680 нм. Слабое излучение регистрируется также на длине волны 833 нм. Сравнение экспериментальных спектров с результатами расчета зонной диаграммы показывает, что линия люминесценции при 680 нм соответствует излучению из барьера AlGaAs, а линия при 804 нм обусловлена рекомбинацией экситона в основном состоянии, образованного электроном и тяжелой дыркой, находящимися на первом уровне размерного квантования в квантовых ямах GaAs. Слабое излучение при 833 нм, скорее всего, связано с рекомбинацией на мелких примесях в подложке GaAs. При увеличении температуры образца интенсивность всех линий постепенно уменьшалась и происходил их энергетический сдвиг, соответствующий изменению ширины запрещенной зоны.

На основе данных по положению наинизшего экситонного пика в квантовой яме был сделан квантовомеханический расчет более высоких экситонных уровней и были рассчитаны параметры структуры, в которой брэгговское условие (1) дожно выполняться для экситонов, образованных тяжелыми дырками и электронами второго уровня размерного квантования. Соответствующий образец с 60 квантовыми ямами (7-789) был выращен по технологии, идентичной технологии образца 7-787.

Спектры фотолюминесценции при 4К для образца 7-789 с периодической системой из 60 квантовых ям представлен на рис. 1 сплошной линией. Видно, что по энергетическому положению соответствующих линий излучения образцы 7-787 и 7-789 весьма близки, что отражает хорошую воспроизводимость технологического процесса. Для линии экситона в квантовых ямах x(e1-hh1) пиковые длины волн составляют 803.90 и 804.16 нм соответственно при практически одинаковой полной ширине на половине интенсивности FWHM = 1.5 нм. Увеличение числа квантовых ям привело к возрастанию в ~ 20 раз пиковой интенсивности люминесценции квазидвумерного экситона и существенному уменьшению излучения из подложки GaAs. Последнее связано со значительным увеличением толщины структуры.

На рис. 2 представлены спектры отражения образца 7-789, содержащего 60 квантовых ям, при температуре 4 K, различных углах падения и поляризациях света. В спектрах можно выделить несколько различных вкладов.

1. Отражение от границы раздела фаз с различными показателями преломления определяется известными формулами Френеля [21]. В частности, при нормальном падении света из вакуума (воздуха) на среду с показате-



Рис. 2. Спектры отражения (температура 4 K) при различных углах падения и поляризациях (s, p) света от образца 7-789, содержащего систему из 60 квантовых ям. Числа у кривых означают угол падения в градусах. Стрелками указано положение спектральных особенностей, соответствующих экситонам x(e2-hh2), x(e1-lh1) и x(e1-hh1) в квантовых ямах, а также отражению от объемных экситонов подложки GaAs.



Рис. 3. Положение основного пика брэгтовского отражения от структуры с 60 квантовыми ямами при температурах 4, 77 и 300 К. Сплошные линии — расчет по соотношению (1) с эффективным показателем преломления структуры n = 3.6.

лем преломления n коэффициент отражения равен

$$R = \left| \frac{n-1}{n+1} \right|^2. \tag{2}$$

Для n = 3.6 R = 0.32, что хорошо согласуется с результатами наблюдений (рис. 2). При увеличении угла падения света по мере приближения к углу Брюстера (74.5° для n = 3.6) коэффициент отражения для *s*-поляризации увеличивается, а для *p*-поляризации уменьшается, что хорошо видно из рис. 2.

2. Отражение от среды с периодической модуляцией показателя преломления характеризуется основным пиком на длине волны, отвечающей условию Брэгга (1), сопровождающимся дифракционной картиной с большим числом побочных минимумов и максимумов. Как видно из рис. 2, основной максимум брэгговского отражения при нормальном падении света соответствует длине волны 770 нм. В соответствии с законом Брэгга (1) при увеличении угла падения максимум отражения смещается в область более коротких волн. Рис. 3 иллюстрирует это явление при различных температурах. Сплошными линиями на рис. 3 показано изменение угла брэгговского отражения в соответствии с соотношением (1) для среды с собственным показателем преломления n = 3.6 при учете показателей преломления криогенных жидкостей. Видно, что соотношение (1) дает в целом удовлетворительное описание эксперимента.

3. Помимо достаточно плавных изменений коэффициента отражения, обусловленных брэгговской дифракцией в спектре (рис. 2), наблюдается ряд резких особенностей (отмечены стрелками), обусловленных взаимодействием света с электронными возбуждениями. Наиболее длинноволновая из таких особенностей наблюдается на длине волны 818 нм, что соответствует краю поглощения подложки GaAs. Более коротковолновые особенности обусловлены взаимодействием света с экситонными возбуждениями в квантовых ямах. Резкое изменение коэффициента отражения на длине



Рис. 4. Особенности спектра отражения, вызванные экситонными состояниями x(e2-hh2), x(e1-lh1) и x(e1-hh1) в образце 7-789 с периодической системой из 60 квантовых ям. Точки — эксперимент, сплошные кривые — лоренцевская аппроксимация. Параметры лоренцевых кривых приведены в таблице.

Физика и техника полупроводников, 2010, том 44, вып. 9

Число квантовых ям	Экситонное состояние	Энергия перехода, эВ	Ширина линии FWHM, эВ	Интегральная интенсивность, отн. ед.
60	x(e1-hh1)	1.5416 ± 0.0001	0.0026 ± 0.0002	$5.6 \cdot 10^{-4}$
	x(e1-lh1)	1.5499 ± 0.0001	0.0039 ± 0.0006	$4.4 \cdot 10^{-4}$
	x(e2-hh2)	1.6281 ± 0.0001	0.0049 ± 0.0002	$5.2 \cdot 10^{-4}$
1	x(e1-hh1)	1.5425	0.0024 ± 0.0001	
	x(e1-lh1)	1.5519	0.0022 ± 0.0001	

Параметры экситон-поляритонных состояний для системы 60 квантовых ям и для одиночной квантовой ямы при 4.2 К и нормальном падении света

волны 804 нм соответствует взаимодействию света с основным состоянием экситонов, образованных тяжелыми дырками и электронами на первом уровне размерного квантования в квантовых ямах. Пик на длине волны 800 нм соответствует экситону, образованному легкими дырками и электронами на первом уровне размерного квантования. Соответствующие энергии согласуются с результатами квантово-механических расчетов при известных параметрах ям GaAs и барьеров AlGaAs. Такие расчеты предсказывают положение второго уровня размерного квантования экситона с тяжелыми дырками при 1.616 эВ, что соответствует длине волны света в вакууме 767 нм. Эта длина волны отвечает брэгговскому условию при угле падения света ~ 23°. Как можно видеть из рис. 2, при этом угле падения света действительно происходят увеличение коэффициента отражения и увеличение ширины брэгговского резонанса.

Для определения количественных параметров экситонных состояний в исследованных структурах соответствующие особенности спектров отражения при нормальном падении света были аппроксимированы лоренцевыми контурами. Экспериментальные и расчетные контуры отражения при 4.2 К для состояний x(e2-hh2), $x(e_1-lh_1)$ и $x(e_1-hh_1)$ при нормальном падении света приведены на рис. 4. Полученные значения параметров экситонных линий приведены в таблице. Видно, что экситонное состояние $x(e_2-hh_2)$, образованное электронами и дырками на втором уровне размерного квантования в квантовых ямах, характеризуется большей шириной линии по сравнению с состоянием $x(e_1-hh_1)$. При нормальном падении света на образец 7-789 при 4К энергия экситонного состояния x(e2-hh2) находится вблизи, но не соответствует точно энергии брэгговского резонанса. При этом в спектре отражения на рис. 2 можно раздельно наблюдать пики отражения, обусловленные периодической системой экситонов x (e2-hh2) и периодической системой тонких слоев (квантовых ям) с показателем преломления, отличающимся от показателя преломления барьеров.

При выполнении борэгтовского условия на частоте экситонных поляритонов x(e2-hh2), что реализуется при угле падения света $\sim 23^{\circ}$, происходит объединение двух описанных выше стоп-зон для распространения света в образце. В этом случае разделение вкладов с

Физика и техника полупроводников, 2010, том 44, вып. 9

помощью простого феноменологического анализа резонансных особенностей спектров отражения весьма затруднительно. Для количественного анализа требуется расчет спектров отражения с учетом всех трех вкладов одновременно. Это будет проделано в последующих работах.

При значительной расстройке частот экситон-поляритонного и брэговского резонансов формирования суперизлучательной моды не происходит, и определенные в этом режиме параметры экситонных особенностей отражения света несут информацию о силе осциллятора и безызлучательном уширении, происходящем из-за изменения параметров ям в системе и процессов рассеяния в отдельных ямах. Для выяснения влияния различных факторов представляет интерес сравнить экситонные особенности отражения от периодической системы из 60 квантовых ям (рис. 4) и от одиночной квантовой ямы.

Особенности спектра отражения при 4.2 К и нормальном падении света для образца 7-787 с одиночной квантовой ямой показаны на рис. 5 (экспериментальные точки). Видны особенности, обусловленные экситонны-



Рис. 5. Особенности спектра отражения, вызванные экситонными состояниями $x(e_1-lh_1)$ и $x(e_1-hh_1)$ в образце 7-787 с одиночной квантовой ямой. Точки — эксперимент, сплошные кривые — лоренцевская аппроксимация. Параметры лоренцевых кривых приведены в таблице.

ми состояниями $x(e_1-lh_1)$ и $x(e_1-hh_1)$. Достоверно идентифицировать особенности, связанные с состоянием $x(e_2-hh_2)$, нам не удалось. Для экситонных состояний *x*(*e*1–*lh*1) и *x*(*e*1–*hh*1) был проведен численный анализ формы линии, которая, как видно из рис. 5, хорошо описывается лоренцевой кривой. Параметры подгонки лоренцева спектра к эксперименту приведены в таблице. Следует отметить, что фаза спектрального контура для одиночной квантовой ямы оказалась близкой к 90° (ср. рис. 5 и 4), что не позволяет провести прямое сравнение интенсивностей экситонных пиков отражения от 60 и 1 квантовых ям. Из рис. 5 и численного анализа для одиночной квантовой ямы следует, что интенсивности пиков $x(e_1-lh_1)$ и $x(e_1-hh_1)$ различаются примерно вдвое, что отражает разницу силы осциллятора для этих двух типов экситонов.

Важно отметить, что ширина пиков отражения для $x(e_1-lh_1)$ и $x(e_1-hh_1)$ в одиночной квантовой яме примерно одинакова и составляет (2.2 ± 0.1) и (2.4 ± 0.1) мэВ соответственно. При этом ширина пика отражения для состояния экситонов $x(e_1-hh_1)$ в периодической системе из 60 квантовых ям остается практически такой же, что и в одиночной квантовой яме, а именно (2.6 ± 0.2) мэВ. Следовательно, полученная нами система квантовых ям обладает относительно малым разбросом параметров. Причина кажущегося уширения пика, обусловленного состоянием $x(e_1-lh_1)$ в системе 60 квантовых ям, возможно, состоит в меньшей точности подгонки из-за меньшей интенсивности этого пика и его перекрытия с иными интерференционными пиками.

Весьма значительная ширина пика x(e2-hh2) для системы, по-видимому, обусловлена иными причинами. Наиболее важной из них является электромагнитное взаимодействие экситонных поляритонов в системе квантовых ям, когда периодичность системы близка к брэгговской, что при нормальном падении света реализуется для системы экситонов x(e2-hh2). Расстройка системы относительно брэгговского условия должна приводить к разрушению суперизлучательной моды. Действительно, как видно из рис. 2, состояние x(e2-hh2) весьма сложно идентифицировать в спектре оптического отражения при углах падения света 68 и даже 45°.

Таким образом, экспериментально наблюдаемые спектры отражения от РБС с периодической системой квантовых ям хорошо качественно и количественно описываются при учете трех вкладов, различных по своей физической природе. Нами экспериментально обнаружено значительное усиление отражения, обусловленное периодической системой экситонов в состоянии x(e2-hh2) при настройке этой системы на длину волны брэгговского резонанса. Такой двойной резонанс приводит к формированию суперизлучательной моды, характеризующейся значительно более высоким параметром радиационного затухания.

Авторы благодарны Е.Л. Ивченко, А.Н. Поддубному и М.М. Воронову за полезные обсуждения.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 09-02-12313) и Российской академией наук.

Список литературы

- [1] Vertical cavity surface emitting lasers, ed. by L.A. Coldren, H. Temkin, C.W. Wilmsen (Cambridge Univ. Press, 1999).
- [2] Е.Л. Ивченко, А.И. Несвижский, С. Йорда. ФТТ, 36, 2118 (1994).
- [3] В.А. Кособукин, М.М. Моисеева. ФТТ, 37, 3694 (1995).
- [4] E.L. Ivchenko, M. Willander. Phys. Status Solidi B, 215, 199 (1999).
- [5] L.I. Deych, A.A. Lisyansky. Phys. Rev. B, 62, 4242 (2000).
- [6] T. Ikawa, K. Cho. Phys. Rev. B, 66, 85338 (2002).
- [7] L. Pilozzi, A. D'Andrea, K. Cho. Phys. Rev. B, 69, 205311 (2004).
- [8] E.L. Ivchenko, M.M. Voronov, M.V. Erementchouk, L.I. Deych, A.A. Lisyansky. Phys. Rev. B, 70, 195 106 (2004).
- [9] М.М. Воронов, Е.Л. Ивченко, А.Н. Поддубный, В.В. Чалдышев. ФТТ, 48 (9), 1814 (2006).
- [10] M.V. Erementchouk, L.I. Deych, A.A. Lisyansky. Phys. Rev. B, 73, 115 321 (2006).
- [11] М.М. Воронов, Е.Л. Ивченко, В.А. Кособукин, А.Н. Поддубный. ФТТ, 49 (9), 1709 (2007).
- [12] Е.Л. Ивченко, В.П. Кочерешко, А.В. Платонов, Д.Р. Яковлев, А. Baar, В. Оссау, Г. Ландвер. ФТТ, 39, 2072 (1997).
- [13] M. Hubner, J. Kuhl, T. Stroucken, A. Knorr, S.W. Koch, R. Hey, K. Ploog. Phys. Rev. Lett., 76, 4199 (1996).
- [14] C. Ell, J. Prineas, T.R. Nelson, jr., S. Park, H.M. Gibbs, G. Khitrova, S.W. Koch. Phys. Rev. Lett., 80, 4795 (1998).
- [15] G.R. Hayes, J.L. Staehli, U. Iesterle, B. Deveaud, R.T. Phillips, C. Ciuti. Phys. Rev. Lett., 83, 2837 (1999).
- [16] J.P. Prineas, C. Ell, E.S. Lee, G. Khitrova, H.M. Gibbs, S.W. Koch. Phys. Rev. B, 61, 13863 (2000).
- [17] В.В. Чалдышев, А.С. Школьник, В.П. Евтихиев, Т. Holden. ФТП, **40** (12), 1466 (2006).
- [18] В.В. Чалдышев, А.С. Школьник, В.П. Евтихиев, Т. Holden. ФТП, **41** (12), 1455 (2007).
- [19] D. Goldberg, L.I. Deych, A.A. Lisyansky, Z. Shi, V.M. Menon, V. Tokranov, M. Yakimov, S. Oktyabrsky. Nature Photonics, 3, 662 (2009).
- [20] J.P. Prineas, C. Cao, M. Yildirim, W. Johnston, M. Reddy. J. Appl. Phys., **100**, 063 101 (2006).
- [21] М. Борн, Э. Вольф. Основы оптики (М., Наука, 1973).

Редактор Л.В. Шаронова

Resonant Bragg structure (AIGaAs/GaAs/AIGaAs)₆₀ based on the second quantum confinement level of the excitons with heavy holes in the quantum wells

V.V. Chaldyshev, D.E. Sholohov, A.P. Vasil'ev

loffe Physicotechnical Institute Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia

Abstract A study has been done on photoluminescence and optical reflectance spectra from multiperiodic structures containing 60 GaAs quantum wells separated by AlGaAs barriers non-transparent for tunneling. The feature of the structure was that at a certain angle of light incidence ($\sim 23^{\circ}$) the Bragg condition of resonant reflection was met for the photon energy equal to the energy of heavy-hole excitons at the second quantum confinement level in the quantum wells. It is shown experimentally that the condition of a superradiant optical mode. The dependencies of Bragg and exciton–polariton reflectance on the angle of light incidence, polarization and temperature were studied.